

第 34 回分析電子顕微鏡討論会参加報告

共通機器部門 前田誠

1. はじめに(目的等)

分析電子顕微鏡討論会とは、電子顕微鏡に関する装置、技術、手法に関する発表が行われる学会である。参加者は大学教員、研究員、一般企業の研究員、電子顕微鏡販売メーカーの研究、開発者と幅広い。毎年何らかのテーマに沿って、特定の技術ないし解析法に関する発表を集中的に行い、会場との質疑応答の中でその技術・解析法に関する理解を深めていくのが特徴的である。今年にはエネルギー分散型 X 線分析装置 (EDS) と電子エネルギー損失分光装置 (EELS) がテーマであり、双方共に私の業務と深く関連することから、それらの理解をより深めるために参加した。

2. 期間・場所

期間： 平成 29 年 9 月 4 日 (火) ～6 日(木)

場所： 幕張メッセ工作会議場 国際会議室

3. 参加者等

電子顕微鏡を利用して研究・開発を行っている大学等に所属する学生・教員、もしくは企業の技術者・研究者 約 150 名

4. 具体的な参加内容

4日 台風 21 号の影響により、新幹線が運休していたため、自宅待機

5日 「構造生物学を激変させたクライオ電顕」を聴講，一般講演として EELS を含む発光スペクトル分析に関する講演を聴講

6日 移動日

5. まとめと感想

台風 21 号の影響により、4 日に聴講を予定していた講演を聞けなかったのは残念だった。但し、予稿集には 4 日の講演内容も含まれており、講演内容を把握することはできた。EDS, EELS を含む電子顕微鏡付属の分析装置の発展は著しく、10 年前は難しかったことが今はできるという事例が増えている。特に、EDS では、エネルギー分解能の向上はもちろん、測定効率の改善や測定時間の短縮、液体窒素が不要になるなど技術進歩による改善点は多い。学会参加を通して、今後も技術・装置の進歩に合わせて、自分の知識を更新させる必要があると感じた。